

Curso	Transmisión de energía eléctrica
Tema	5. Análisis de fallas
Subtema	5.3. Componentes simétricas
Componente	Autoevaluación

Uso de componentes simétricas para el análisis de fallas - Autoevaluación

Ahora, responde las siguientes preguntas:

Pregunta 1:

El procedimiento más empleado para estudiar sistemas eléctricos de potencia desbalanceados es el llamado _____.		
Opciones de respuesta		Respuesta correcta
A)	Método de las componentes simétricas	x
B)	Método de Kirchhoff	
C)	Ninguna de las anteriores	
Retroalimentación para la respuesta correcta:		
El procedimiento más empleado para estudiar sistemas eléctricos de potencia desbalanceados es el llamado método de las componentes simétricas.		
Retroalimentación para las respuestas incorrectas:		
La respuesta correcta es la A. El procedimiento más empleado para estudiar sistemas eléctricos de potencia desbalanceados es el llamado método de las componentes simétricas.		

Pregunta 2:

Un sistema eléctrico de potencia trifásico desbalanceado se puede estudiar directamente aplicando las leyes de _____.		
Opciones de respuesta		Respuesta correcta
A)	Newton	
B)	Tesla	
C)	Kirchhoff	x
Retroalimentación para la respuesta correcta:		

Un sistema eléctrico de potencia trifásico desbalanceado se puede estudiar directamente aplicando las leyes de Kirchhoff

Retroalimentación para las respuestas incorrectas:

La respuesta correcta es la C. Un sistema eléctrico de potencia trifásico desbalanceado se puede estudiar directamente aplicando las leyes de Kirchhoff.

Pregunta 3:

La aplicación del método de componentes simétricas se emplea principalmente para el estudio de _____.

Opciones de respuesta		Respuesta correcta
A)	Subestaciones	
B)	Circuitos	x
C)	Transformadores	

Retroalimentación para la respuesta correcta:

La aplicación del método de componentes simétricas se emplea principalmente para el estudio de circuitos.

Retroalimentación para las respuestas incorrectas:

La respuesta correcta es la B. La aplicación del método de componentes simétricas se emplea principalmente para el estudio de circuitos.